高輝度ビーム実現に向けた cERL 入射器空洞のカプラーキックの評価 EVALUATION OF COUPLER KICK OF CERL INJECTOR CAVITY FOR HIGH BRIGHTNESS BEAM REALIZATION

布袋貴大 *^{A)}、宮島司 ^{B)}、加藤龍好 ^{B)} Takahiro Hotei^{* A)}, Tsukasa Miyajima^{B)}, Ryuko Kato^{B)} ^{A)}The Graduate University for Advanced Studies, SOKENDAI ^{B)}High Energy Accelerator Research Organization, KEK

Abstract

Three 2-cell superconducting cavities are installed in cERL injector at KEK. 2-cell cavity has two input couplers and five HOM couplers. These couplers make the RF field distribution in cavity asymmetric. We numerically and experimentally analyzed the effect of coupler on RF field int 2-cell cavity. As a result, it was shown that the HOM coupler mainly generates the asymmetry of the RF field.

1. はじめに

超伝導空洞は高電界で大電流のビームを加速でき る特徴を持つ。しかし大電流ビームが流れるために、 加速に不要な空洞の高調波モードが励起されてしま い、次に通過するビームへ悪影響を及ぼすことが知 られている。ビームが励起する高調波を減衰するた めの方法として、空洞にアンテナを設置して空洞外 に逃がす・セラミックなどの吸収体を取り付ける等 の方法がある。アンテナ型の高調波結合器 (HOM カ プラー)を用いると、吸収体を取り付ける場合と比べ 小型化することが可能である反面、空洞の円筒対称 性が崩れてしまう。空洞の対称性が崩れることによ り、加速モードの電磁場分布も円筒対称な分布から 変化する。この電磁場分布の非対称性が与えるビー ムへの影響はカプラーキックとして知られている。

これまでのカプラーキックの研究は [1] のように 9cell 空洞のものが多く、エネルギーも 10 MeV を超 えた入射粒子に対しての研究がほとんどであった。 一方で KEK にある cERL の入射超伝導空洞 [2] は個 別に電圧を変えられる・位相の調整ができるなどの 利点から Fig. 1 に示す 2cell 空洞を 3 台並べている。 2cell などセル数の少ない空洞程カプラーが影響する 割合が大きいので、カプラーキックの影響は 9cell 空 洞よりも顕著になると考えられる。ERL 入射空洞は エネルギー回収がないため、大電力を投入し続ける



Figure 1: 2cell superconducting cavity using in cERL injector.

必要がある。電力投入用の入力カプラーを2本、そ れぞれのカプラーキックの影響を打ち消すように上 下対称にインストールされる。また短い輸送距離で ビームを加速できるように小型化を意識して高調波 の減衰には HOM カプラーを使用している。3本の HOM カプラーがあるビーム入射面には空洞内のパ ワーをモニターする用の pick up ポートも設置され ている。これらの存在により空洞の対称性は崩れて いる。

cERLではフォトカソード電子銃を用いており、励 起用レーザーはピンホールで切り出しているため、 レーザー並びに出射される電子ビームは円形のプ ロファイルをしている。しかし入射器空洞通過後の ビームプロファイルが Fig. 2 のように垂直方向に伸 びた楕円になることが知られている。円筒対称な電 磁場分布が空洞内に存在していれば、ビームの受け る収束力は水平・垂直方向で対称になっている。そ のためプロファイルが縦長になる原因として、空洞 内の電磁場分布の非対称性が疑われる。

我々は以下の目的で本研究を実施した。

- 入射超伝導空洞によるカプラーキックがビーム プロファイルを楕円にする原因であることを証 明する。
- 実験結果を再現するモデルを作成し、空洞内の 電磁場分布を明らかにする。
- ・個別のカプラーからの寄与を定量評価し、カプ ラーキックの主要因を同定する。



Figure 2: Beam profile at downstream of cavity (left: RF off, right: RF on). The resolution of the camera is 57.3μ m/pixel.

^{*} hotei@post.kek.jp

2. 空洞内電磁場解析と収束力評価

実際の空洞は Fig. 1 に示されているようにカプ ラーの存在によって円筒対称性が失われている。そ れに伴い内部の電磁場分布も変化しているはずであ る。カプラーによる電磁場分布の変化を調べるため、 CST [3] を用いて空洞内の加速モードの分布を計算 した。それぞれ、カプラーなしの2セルだけがある モデル、pick up ポートだけを取り付けたモデル、入 カカプラー2本のみのモデル、HOM カプラーのみの モデル、入力・HOM カプラー全てを含めた実機モデ ルの4種類である。計算された中心軸上での電場分 布を Fig.3 に示す。πモードの定在波型空洞であり、 周波数は 1.3 GHz である。 z = 0 がセル間の中心であ り、マイナス側からプラス側ヘビームは移動してい く。Figure 3 より全部のカプラーを含めた場合、中心 軸上にも横方向の電場が生じており、電磁場分布が 歪められていることがわかる。また入力カプラーの み、HOM カプラーのみ、pick up ポートのみが存在す る場合の結果も一緒に表示している。HOM カプラー のみを残して計算した結果は全てのカプラー付きの モデルとよく一致している。また入力カプラーによ る影響は対称性から中心軸上ではちょうど打ち消さ れていることがわかる。



Figure 3: Electric field distribution on z-axis.



Figure 4: Plot for transverse electric field and magnetic field at $(r, \theta) = (1 \text{ mm}, 0^{\circ}), (1 \text{ mm}, 90^{\circ})$ (Top: Input coupler only model, bottom: HOM coupler only model).

次に電磁場分布の非対称性を調べるため、 $(r, \theta) =$ (1 mm, 0°), (1 mm, 90°) における横方向電場 E_r と磁 場 B_θ を比較した。これらはそれぞれ x 軸上の点、y軸上の点に対応する。比較した結果を Fig. 4 に示す。 上段は入力カプラーのみのモデルを使用した結果で ある。r = 1 mm のところでは水平・垂直方向の電 磁場に大きな違いは見られない。下段は HOM カプ ラーのみを使用した計算結果であり、電磁場は水平・ 垂直方向で差が生じている。これから電磁場分布が 水平・垂直方向で非対称になっていることがわかる。

3. シングルキック応答解析

具体的に電磁場から受ける収束力を評価するために、CSTによって計算された電磁場分布を粒子トラッキングコード GPT [4] へ取り込み、シングルキック応答から実際の粒子に対する影響を評価する。

まず粒子の応答から収束力を求める原理を説明す る。上流から順に粒子に角度を与える偏向磁石、収束



Figure 5: Layout of tracking or experiment for single kick response measurement.



Figure 6: Mapping of beam position at monitor (red: Input coupler x^2 + HOM coupler x^5 , orange: Input coupler x^2 only, blue: HOM coupler x^5 only).

力を測りたい収束レンズ、ビーム位置を測定するモ ニターからなる Fig. 5 のようなレイアウトを考える。 各機器はそれぞれ L_1, L_2 だけ離れている。偏向磁石 は小さく粒子の角度だけが変化すると考えると、初 期条件 (x_0, x'_0) はモニター位置まで次のように転送 される。

$$\begin{pmatrix} x \\ x' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & L_2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -k & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & L_1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ \theta \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x_0 \\ x'_0 \end{pmatrix} \end{bmatrix}$$
(1)

偏向磁石によるキック量を変えた時のビーム位置の 差分を求めると

$$\frac{\Delta x}{\Delta \theta} = L_1 + L_2 - L_1 L_2 k \tag{2}$$

であり、ビーム位置の変化量からレンズの収束力を 求めることができる。

トラッキングは実験と比較するために cERL 入射 器のレイアウトで実施した。この場合、粒子に角度を 与える偏向磁石は、水平・垂直の軌道補正用ステア リングである。運動エネルギー 500 kev の粒子に対す るステアリングの蹴り角は磁場計算より 11 mrad/A と得られた。レンズは入射超伝導空洞であり、下流 のスクリーンモニターで粒子位置を測定することに なる。各機器の間隔は $L_1 = 0.702$ m, $L_2 = 2.308$ m である。

入力カプラー・HOM カプラー全てのアンテナを 含めたモデル、HOM カプラーなしで 2 本の入力カ プラーのみ、入力カプラーなしで 5 本の HOM カプ ラーのみの 3 通りのモデルを用いてトラッキングを 行った。キック量を変えた時の最終的なビームの横 方向位置をプロットしたものを Fig.6 に示す。入射

Model	$\Delta x \; [{\rm m/rad}]$	$\Delta y \; [{\rm m/rad}]$
All couplers	1.02	1.32
Input couplers only	1.12	1.22
HOM couplers only	1.05	1.29
Without couplers	1.16	1.16



Figure 7: Mapping of beam position (red: measurement, blue: tracking).

時のビームエネルギーは 1 MeV で、空洞通過後の エネルギーは 2.2 MeV 粒子の空洞に乗る位相は空洞 通過後の粒子のエネルギーが最大になるところで全 て固定している。Figure 6 の赤線で結ばれた格子が 縦長になっていることがわかる。これは水平・垂直 方向のビーム移動量、つまり各方向への収束力が異 なっていることを示している。また入力・HOM カプ ラーを全て含めた場合(赤)と HOM カプラーだけ を残した場合(青)の結果が非常によく一致してい ることがわかる。これより cERL 超伝導空洞のカプ ラーキックの主要因は HOM カプラーであることが わかる。

さらに収束力を定量評価するため、得られたマッ ピング結果からから中心で十字に交わる 2 本の水 平・垂直の結果に対して線形フィットを行い各方向 へのステアリングのキック量に対するビーム位置変 化量を求めた。結果は Table 1 にまとめられており、 参考にカプラーのない円筒対称なモデルの場合の結 果も表示している。ビーム位置変化量が小さいとい うことはそれだけ大きな収束力が働いているという ことになる。円筒対称モデルとの比較により、カプ ラーキックは水平方向の収束力が強め、垂直方向の 収束力が弱めることがわかる。またこの結果からも 非対称な収束力を生じさせている主要因は HOM カ プラーであることがわかる。

Figure 7 に示しているのは、測定と全カプラー付き モデルを用いたトラッキングとの比較である。ビー ム位置の校正は空洞の中心に入射した場合を原点 (0,0) としてプロットしている。トラッキングにお

いては空洞前のステアリングを用いず、中心にまっ すぐ角度をつけずに入射した場合、測定では空洞下 流のスクリーンモニターでビーム位置を測定しなが ら電磁場の位相を振って、ビーム位置の変動が最も 小さいときの輸送条件に相当する。またこのときト ラッキングに用いたステアリングのキック量は、実 験で空洞内の RF を off にし、ドリフト空間としてシ ングルキック応答から校正した値を使用している。 Figure 7 より、特に中心付近では、かなりの精度で一 致していることがわかる。これよりモデルの電磁場 は実際の分布をよく再現していると言える。

4. 考察

本研究では 2 cell 超伝導空洞におけるカプラーキッ クの影響を数値的・実験的に解析を行った。まず cERL の 2 cell 空洞通過後にプロファイルが垂直方向 に長い楕円になるという問題があった。このときの ビームサイズ比は垂直方向の RMS サイズが水平方 向に対して約 1.3 倍だけ大きい。これに関して、カ プラー付きの空洞モデルを使用した場合の単粒子ト ラッキングにおける水平・垂直方向のビーム移動量 比を計算すると約 1.3 であり、ビームサイズ比とよ く一致している。また実際にビーム軌道を測定した 結果とモデル計算がよく一致していることから、計 算に用いた電磁場分布は実際の空洞内の分布を再現 していることがわかる。したがってビームプロファ イルを縦長にする原因はカプラーキックが原因であ ると言える。

トラッキング結果を見ると入力カプラーを取り除 き、HOM カプラーだけを残した結果がすべてのカプ ラーを含めた計算結果と非常によく一致しているこ とがわかる。z軸上の電場分布をみても、入力カプ ラーだけの場合にはそれぞれのカプラーの影響が打 ち消され、中心軸上での横電場が 0 V/m になってい るのに対し、HOM カプラーだけを残した場合には全 てのカプラー付きの結果とほとんど一致した。これ よりカプラーキックの主要因は HOM カプラーであ ると言える。

5. 結論

cERL の 2cell 超伝導空洞を例にして、カプラー キックの影響を数値的・実験的に解析した。計算された電磁場分布を用いたモデル計算の結果と実際 に測定したビーム軌道応答の結果がよく一致したこ とから、モデルは実際の空洞内電磁場分布を反映し ていることがわかった。また実験とモデル計算から cERL で以前から観測されていた空洞通過後のプロ ファイルの変形は空洞内の電磁場分布が非円筒対称 に歪み、水平方向の収束力が強まり、垂直方向の収 束力が弱まったためであると言える。モデル別の解 析結果から空洞内電磁場分布の歪みはカプラー、特 に HOM カプラーによる影響であることがわかった。 さらに軌道応答測定やトラッキング計算からカプ

ラーキックにより非線形な影響が存在することが示 された。本研究ではそこまで論じられていない。RF 場において本質的に重要な位相依存性を含め、分布 を持った場合の影響を評価していくこと、非対称性の緩和・補償方法の確立などが今後の課題である。

謝辞

KEK の許斐太郎氏には基本となる 2cell 超伝導空 洞の CST におけるモデルを作成していただいた。ま た、個別のカプラーからの寄与を計算する際に、モ デルの修正において多大なご協力をいただいた。こ の場を借りて感謝の意を表する。

参考文献

- A. Halavanau *et al.*, "Analysis and measurement of the transfer matrix of a 9-cell, 1.3 GHz superconducting cavity", PRAB 20, 040120 (2017).
- [2] K. Watanabe *et al.*, "Development of the superconducting rf 2-cell cavity for cERL injector at KEK", NIM A 714 (2013) 67-82.
- [3] Computer Simulation Technology; http://www. setjapan.com/software/CST_Overview.php
- [4] Pulsar Physics; http://www.pulsar.nl/got/index. html